

御中

No.GHB1X25-2
2011年11月28日
コーセル株式会社
OS開発部
部長 島野 和良

スイッチング電源SUC6/10(SMDタイプ)ケース外観変更のご案内

拝啓、貴社益々ご隆昌のこととお慶び申し上げます。
毎度格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
さて、表題の件につきまして下記のとおりご案内致しますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

1. 対象モデル

SUC□6/10□□□□□B□:標準品、準標準品、マイナーチェンジ品全てのSMDタイプ機種
例):SUCS60505B□、SUCS100505B□

2. 変更内容

製品実装時の荷重に対する強度向上を目的とし、ケースと基板を直接固定する構造変更を行います。
変更前後の外観を写真2.1、2.2に示し、別紙1-1～1-4に変更前後の外形図を添付致します。
この変更に伴う寸法変更点の抜粋を図2.1～2.3に示します。
なお、安全規格・電気仕様等の変更はございません。また、ケース外観変更で信頼性の変化はありません(別紙2「信頼性試験一覧」参照)。

参考外観比較写真 (SUCW64812B)

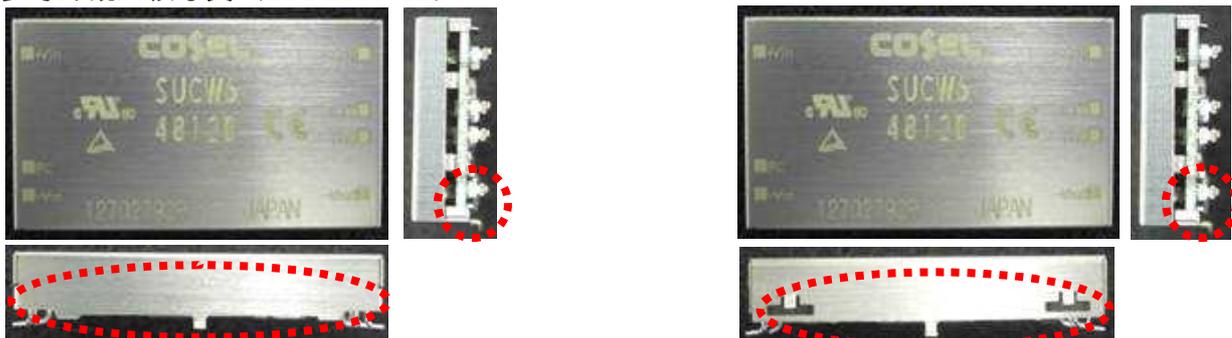


写真2.1 変更前

写真2.2 変更後

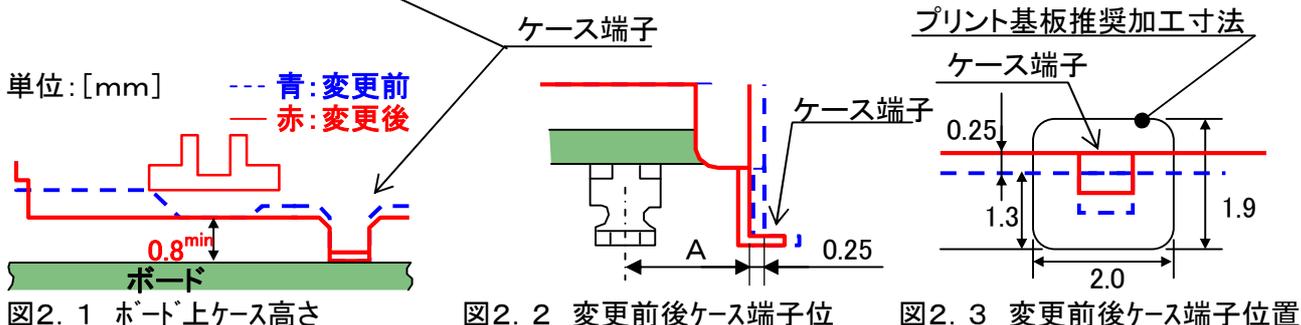


表2.1 ケース端子位置寸法A(図2.2)

単位:[mm]

項番		SUC6	SUC10
1	変更前	2.70~3.70	2.88~3.88
2	変更後	2.70~3.45	2.88~3.63

※ケース端子位置寸法が変更になりますが、変更前の寸法公差内に入ります。
プリント基板推奨加工寸法を使用されている場合は、変更の必要はありません。

3. 適用時期

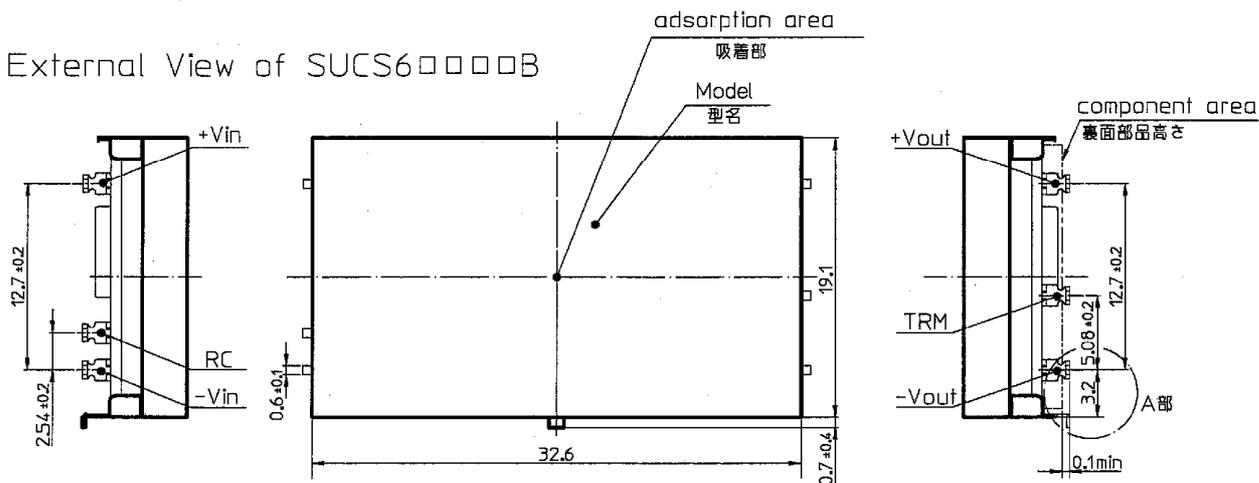
2012年3月1日生産分より、順次切り換え。
(ロットNo. 209□□□□~)

以上

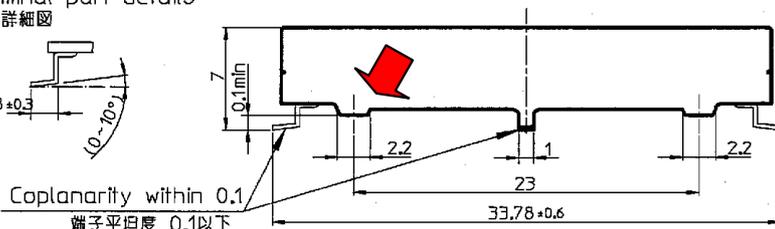
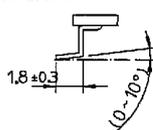


Previous metal case
変更前品ケース形状

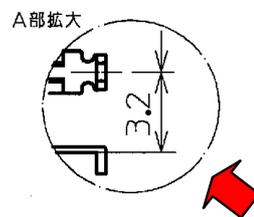
External View of SUCS6□□□□B



※ Terminal part details
端子詳細図

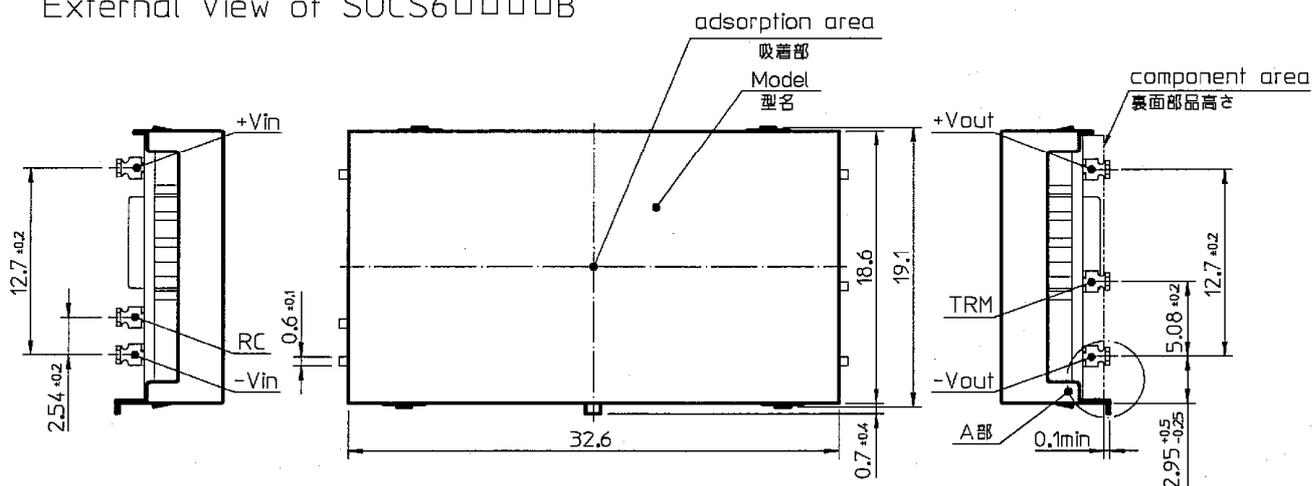


Coplanarity within 0.1
端子平坦度 0.1以下

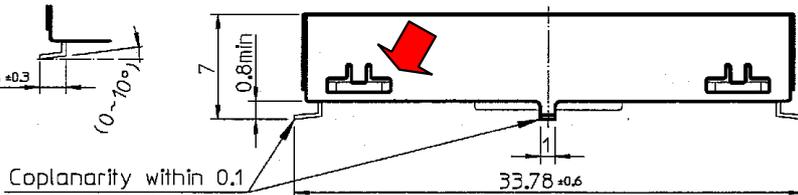
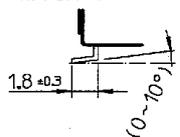


New designed metal case
変更後品ケース形状

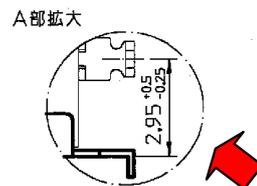
External View of SUCS6□□□□B



※ Terminal part details
端子詳細図



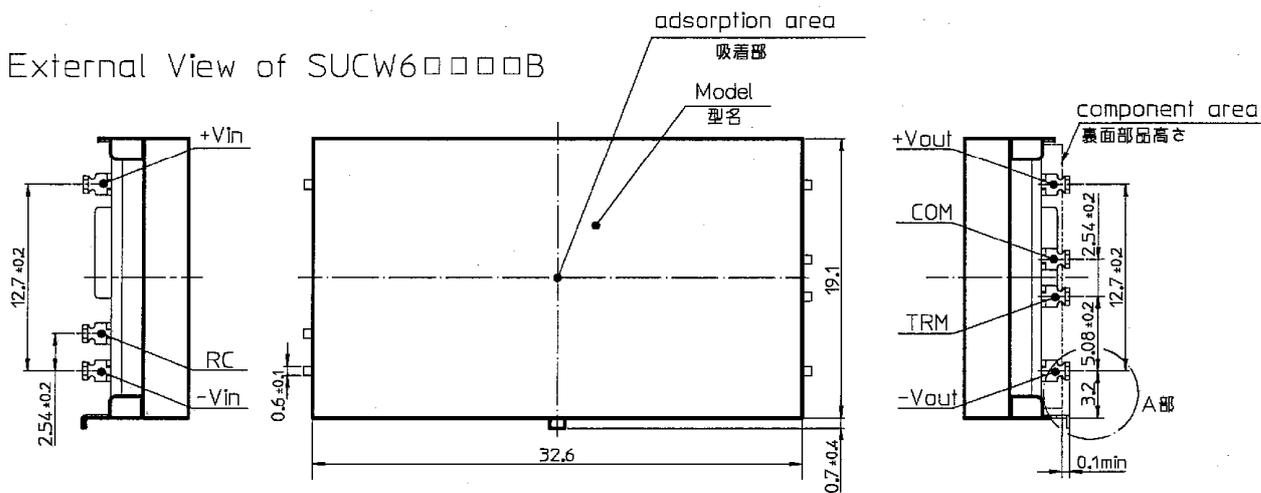
Coplanarity within 0.1
端子平坦度 0.1以下



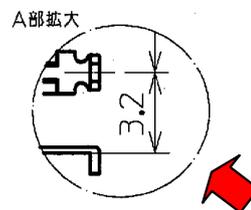
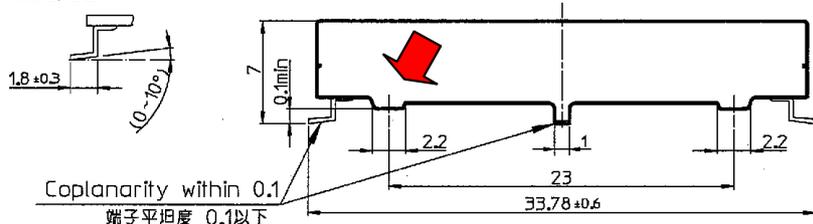


Previous metal case
変更前品ケース形状

External View of SUCW6□□□□B

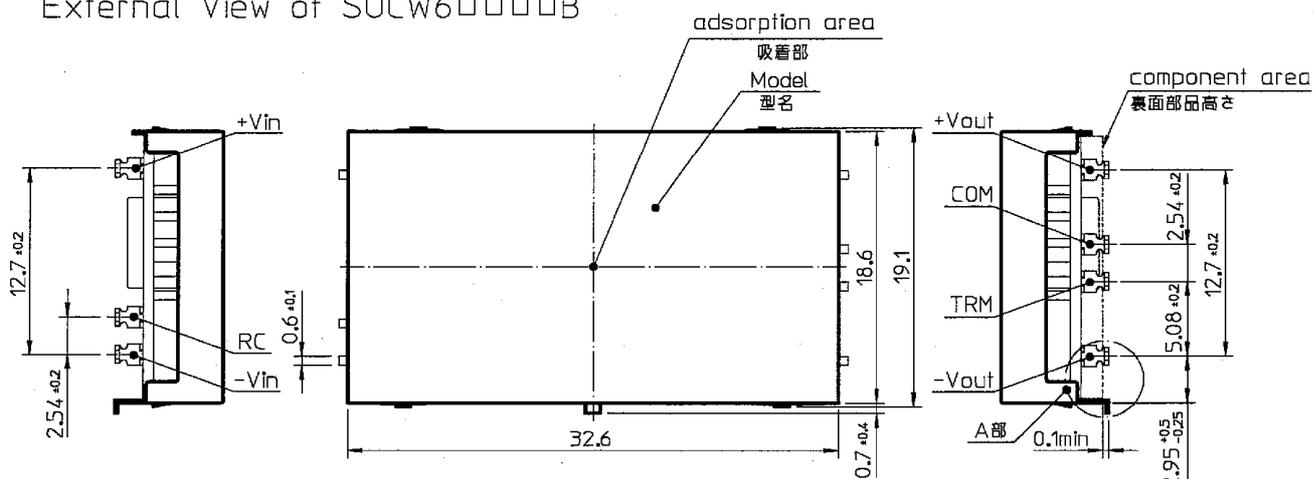


※ Terminal part details
端子詳細図

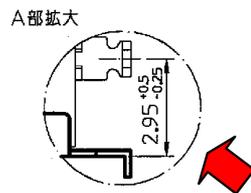
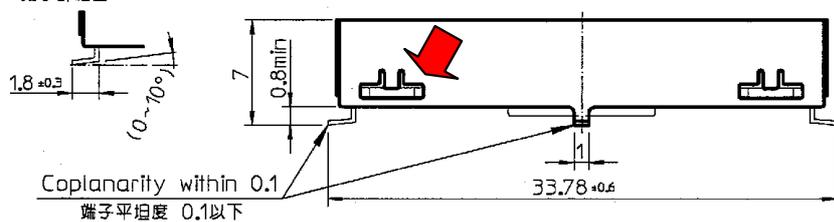


New designed metal case
変更後品ケース形状

External View of SUCW6□□□□B



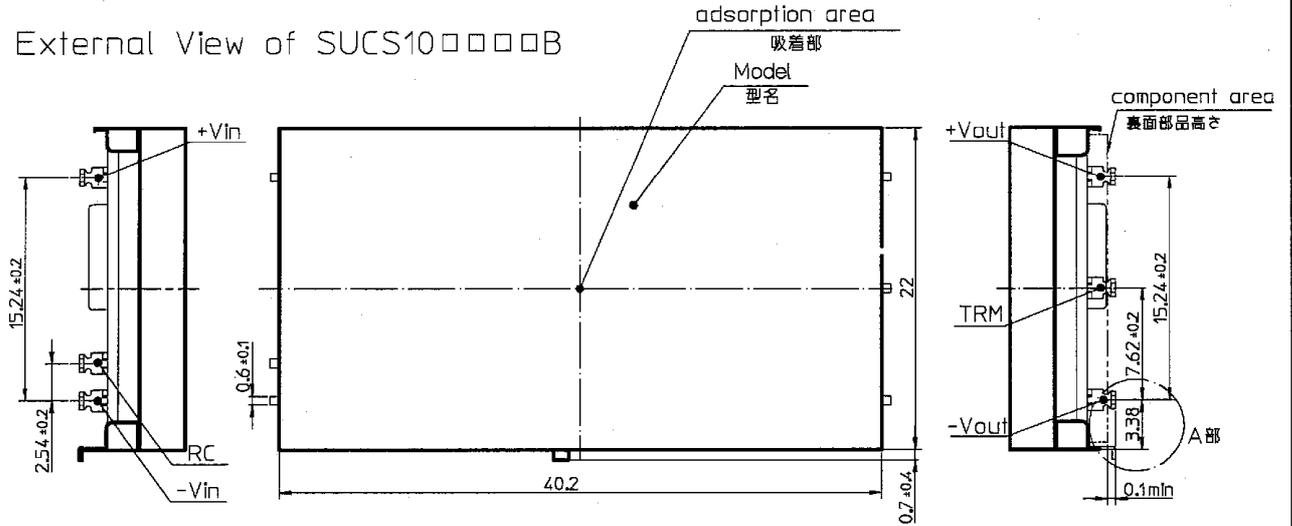
※ Terminal part details
端子詳細図



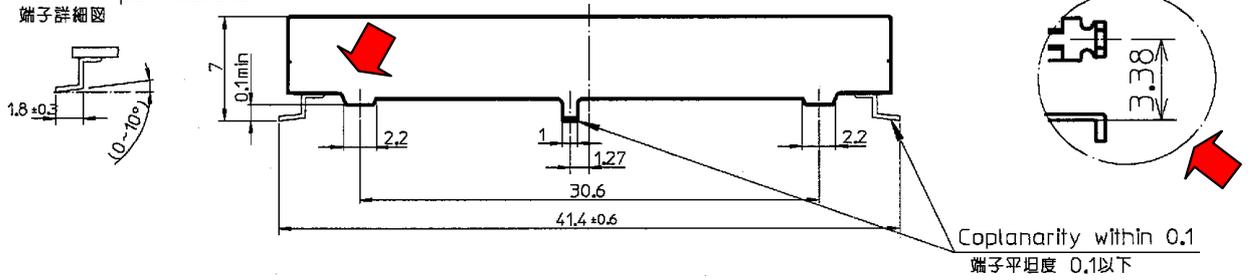


Previous metal case
変更前品ケース形状

External View of SUCS10□□□□B

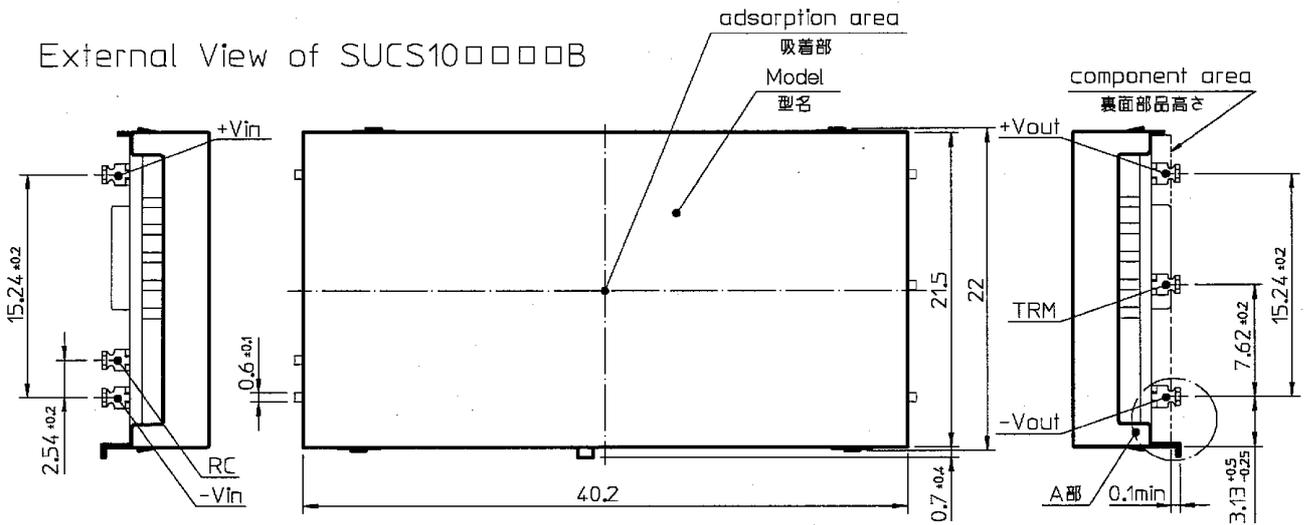


※ Terminal part details
端子詳細図

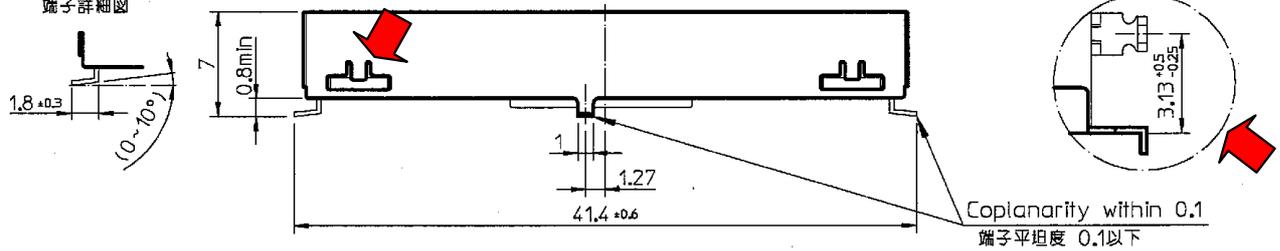


New designed metal case
変更後品ケース形状

External View of SUCS10□□□□B



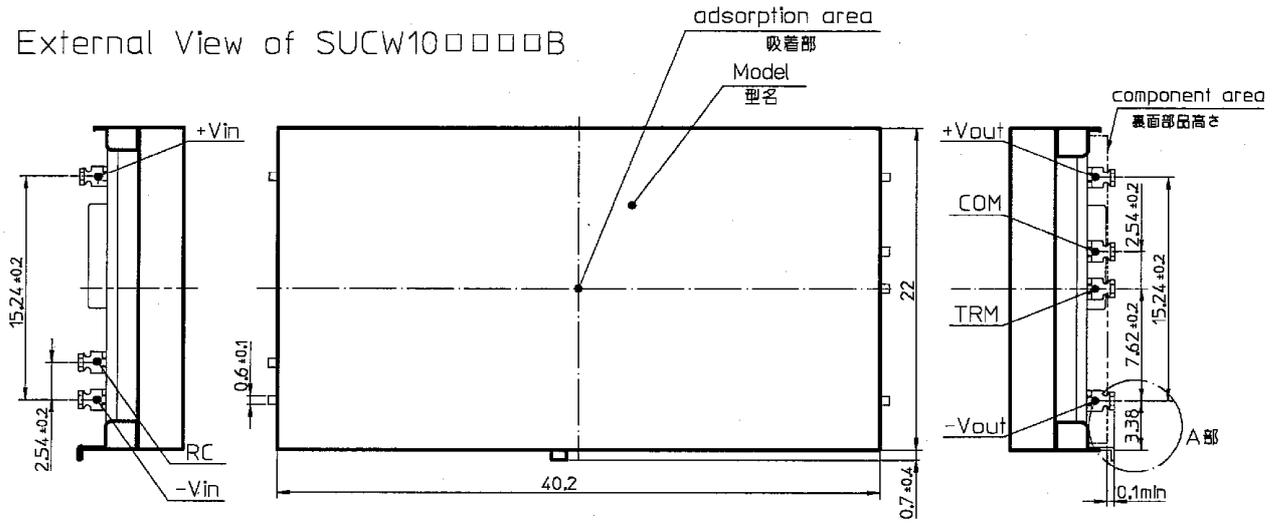
※ Terminal part details
端子詳細図



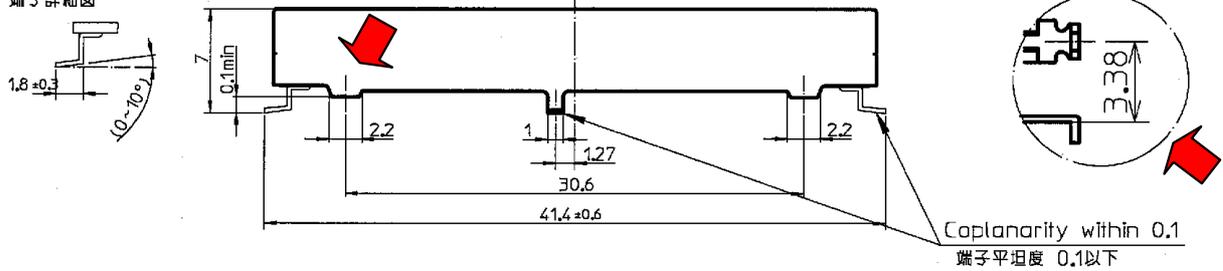


Previous metal case
変更前品ケース形状

External View of SUCW10□□□□B

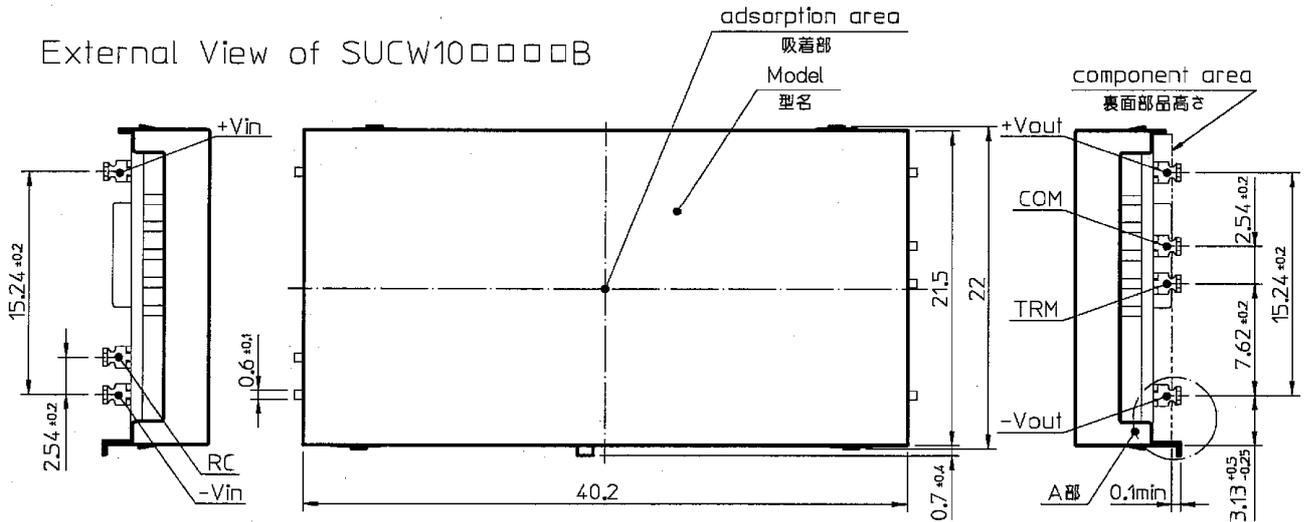


※ Terminal part details
端子詳細図

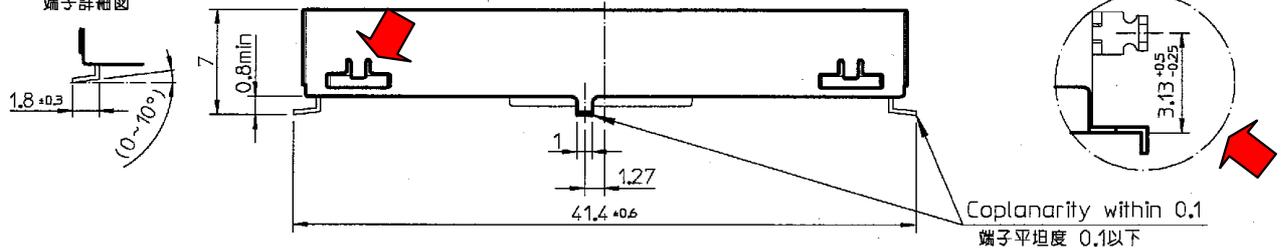


New designed metal case
変更後品ケース形状

External View of SUCW10□□□□B



※ Terminal part details
端子詳細図



SUC6/10シリーズ ケース外観変更に伴う信頼性試験実績一覧表

2011年11月28日
 コーセル株式会社
 OS開発部

項番	試験項目	試験条件	判定条件	サンプル数	合格数
1	温度サイクル試験 (TC)	(1)-40°C⇔125°C各30分 (2)800サイクル	(1)試験前後で電気特性に異常がないこと (2)はんだ付け部にクラックがないこと	5	5
2	高温高湿ハイス試験 (THB)	(1)85°C85%Rh168H	(1)試験前後で電気特性に異常がないこと	3	3
3	振動・衝撃試験	振動 (1)f=10~50Hz:98.0m/s ² (2)周期:3分間 (3)X,Y,Z各60分間	(1)試験前後で電気特性に異常がないこと (2)はんだ付け部にクラックがないこと (3)外観上著しい損傷がないこと	3	3
		衝撃 (1)490.3m/s ² (2)X,Y,Z各1回 (3)11ms	(1)試験前後で電気特性に異常がないこと (2)はんだ付け部にクラックがないこと (3)外観上著しい損傷がないこと		
4	耐電圧試験	(1)入力無通電 (2)仕様値の1.4倍の電圧を印加する	(1)絶縁破壊、フラッシュオーバー、アークなどの異常が生じないこと	1	1
5	絶縁抵抗試験	(1)入力無通電	(1)絶縁抵抗値が仕様値の1.4倍以上であること	1	1
6	雑音端子電圧試験	(1)定格入力電圧印加 (2)定格負荷電流	(1)下記規格に準拠していること FCC Part15 classB, VCCI classB, CISPR22 classB, EN55022-B	1	1
7	雑音電界強度試験	(1)定格入力電圧印加 (2)定格負荷電流	(1)下記規格に準拠していること FCC Part15 classB, VCCI classB, CISPR22 classB, EN55022-B	1	1
8	静電気耐量試験	(1)印加電圧 ±8kV (2)定格入力電圧印加 (3)定格負荷電流	(1)保護回路の誤動作 (2)制御回路誤動作による出力電圧低下 (3)その他機能の誤動作	1	1
9	電圧ハースト試験	(1)定格入力電圧印加 (2)定格負荷電流	(1)保護回路の誤動作 (2)制御回路誤動作による出力電圧低下 (3)その他機能の誤動作	1	1
10	放射電磁界試験	(1)定格入力電圧印加 (2)定格負荷電流 (3)周波数:80MHz~1000MHz :900MHz±5MHz (4)電磁界:12[V/m]	(1)保護回路の誤動作 (2)制御回路誤動作による出力電圧低下 (3)その他機能の誤動作	1	1

備考欄